



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 111758024 A

(43) 申请公布日 2020.10.09

(21) 申请号 201880088392.8

(22) 申请日 2018.12.27

(85) PCT国际申请进入国家阶段日  
2020.08.06

(86) PCT国际申请的申请数据  
PCT/CN2018/124287 2018.12.27

(87) PCT国际申请的公布数据  
W02020/133046 ZH 2020.07.02

(71) 申请人 深圳配天智能技术研究院有限公司  
地址 518063 广东省深圳市南山区粤海街  
道高新区高新南一道德赛科技大厦23  
层(2303-2306室)

(72) 发明人 李洪杰

(74) 专利代理机构 深圳市威世博知识产权代理  
事务所(普通合伙) 44280  
代理人 李庆波

(51) Int.Cl.  
G01N 21/88 (2006.01)

(54) 发明名称

一种缺陷检测方法及装置

(57) 摘要

一种缺陷检测方法及装置,方法包括确定待检测图像中的感兴趣区域(11);将感兴趣区域分割成多个彼此独立且大小相同的卡尺区域(12);对各个卡尺区域进行垂直边缘检测,垂直边为卡尺区域中与卡尺区域的预设边垂直的线段(13);基于垂直边获取感兴趣区域的缺陷信息(14)。方法能够准确有效地实现缺陷检测,提高缺陷检测效率。

